

材料分析 服务

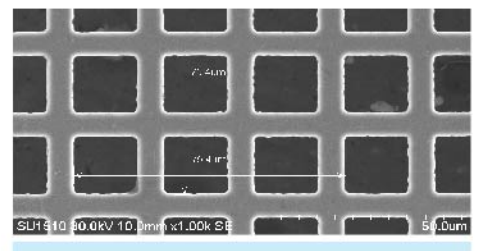
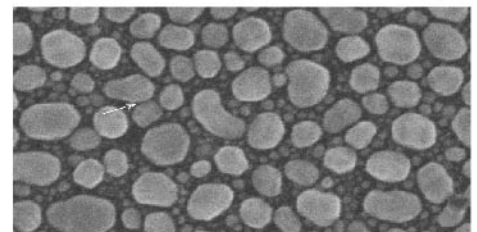
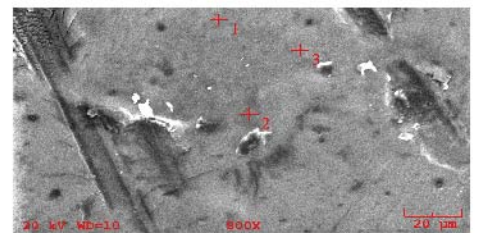


扫描电子显微镜(SEM)由一束细聚焦的电子束轰击样品表面，入射电子与样品的原子核和核外电子发生作用，激发出反映样品形貌、结构和组成的各种信号。

STC最新引进先进的扫描电子显微镜(SEM)，最高分辨率可达3nm，标配二次电子探头和4分割背散射电子探头，并配备了能谱仪(EDS)，这种设备广泛应用于金属、半导体、陶瓷、纺织品等领域，可用于材料表面形貌的分析和微区的化学元素成分分析。

STC拥有先进的技术，可提供广泛的快速的材料分析服务。

测试项目	测试标准 / 要求
微观形貌分析	二次电子，背散射电子
能谱分析(化学成分)	ASTM E1508, GB/T 17359
镀层厚度测试	ASTM B748
断口分析	断口保持洁净
颗粒尺寸分析	颗粒直径大于1 μ m
夹杂物分析	夹杂物大于1 μ m
元素偏聚分析	/



如欲了解更多相关信息，请与我们联系纺织及物料部联系：

香港 电话：+852 3188 8845
东莞 电话：+86 769 8111 9888
上海 电话：+86 21 5219 8248

传真：+852 3188 8840
传真：+86 769 8111 9009
传真：+86 21 5219 8249

电邮：hktmd@stc.group
电邮：dgtmd@stc.group
电邮：shtmd@stc.group

扫描下方二维码，获取更多最新资讯。



www.stc.group